
СОДЕРЖАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- Бобрышов А. П., Солёный С. В.,
Кузьменко В. П., Лач С. Ю., Демченко Г. В.**
Исследование воздействия внешних
условий на качество работы электричес-
ких контрольно-измерительных приборов..... 5
- Катышев А. Д.** Оценка факторов,
влияющих на качество производства
ампул реперных точек 16
- Винниченко А. В., Красовская Е. Д.**
Проектирование интегрированной
автоматизированной системы управления 22
- Шабалина А. Д., Чабаненко А. В.**
Исследование применения аддитивных
технологий в атомной энергетике 29
- Ситкина Е. К., Чабаненко А. В.** Цифровые
двойники: революционный подход
к управлению и оптимизации бизнес-
процессов 33

МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, ВЕЩЕСТВ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

- Сергеев П. А., Солёный С. В., Бобрышов А. П.**
Роботизированный комплекс селективной
пайки выводных электронных компонентов
для предприятий электронной
промышленности..... 38
- Мишура Т. П.** Проектирование USB-
осциллографа и исследование его
метрологических характеристик..... 44
- Штыркин В. А.** Методы расчета эффек-
тивности экранирования радиоэлектронной
аппаратуры при эксплуатации
в полевых условиях 49

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

- Дьяченко А. А., Пинчук М. Э., Суров А. В.,
Никонов А. В., Серба Е. О., Наконечный Г. В.,
Попов С. Д.** Система временной синхро-
низации для изучения процессов в плазме
переменного тока промышленной частоты
методом оптической эмиссионной
спектроскопии..... 60

CONTENTS

PRODUCT QUALITY MANAGEMENT. PRODUCTION ORGANIZATION

- Bobryshov A. P., Solyonyj S. V., Kuzmenko V. P.,
Lach S. Yu., Demchenko G. V.** Investigation
of the impact of external conditions
on the quality of operation of electrical
test and measurement instruments 5
- Katyshev A. D.** Evaluation of factors
influencing production of fixed point cell's
production quality 16
- Vinnichenko A. V., Krasovskaya E. D.**
Designing an integrated automated control
system..... 22
- Shabalina A. D., Chabanenko A. V.**
Investigation of additive technologies
application in nuclear power engineering..... 29
- Sitkina E. K., Chabanenko A. V.** Digital twins:
a revolutionary approach to managing
and optimizing business processes 33

METHODS AND DEVICES OF CONTROL AND DIAGNOSTICS OF MATERIALS, PRODUCTS, SUBSTANCES AND NATURAL ENVIRONMENT

- Sergeev P. A., Solyonyj S. V., Bobryshov A. P.**
Robotic complex for selective soldering
of pin electronic components for electronic
industry enterprises..... 38
- Mishura T. P.** Designing a USB oscilloscope
and studying its metrological characteristics 44
- Shtyrkin V. A.** Methods for calculating
the effectiveness of REA shielding during
field operation 49

INFORMATION-MEASURING AND CONTROL SYSTEMS

- Dyachenko A. A., Pinchuk M. E., Surov A. V.,
Nikonov A. V., Serba E. O., Nakonechny G. V.,
Popov S. D.** Time synchronization system for
studying processes in industrial frequency
alternating current plasma using optical
emission spectroscopy 60

Иванов М. Е., Решетников Д. В.
Нейросетевая коррекция навигационных систем высокоточных беспилотных летательных аппаратов на основе обучения нейросети без учителя..... 68

**ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ
И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Майоров Е. Е., Курлов В. В., Пушкина В. П.
Исследование экспериментальных образцов частично-когерентных источников излучения спектрофотометрической установкой 74

Майоров Е. Е., Арефьев А. В., Гулиев Р. Б.
Применение микроинтерференционного метода для реконструирования томографических данных по оптическим неоднородностям элементов микрооптики 79

Ivanov M. E., Reshetnikov D. V. Neural network correction of navigation systems of high-precision unmanned aerial vehicles based on neural network training without a teacher 68

**FUNDAMENTAL SCIENCES
AND APPLIED RESEARCH**

Maiorov E. E., Kurlov V. V., Pushkina V. P.
Investigation of experimental samples of partially coherent radiation sources by a spectrometric installation 74

Maiorov E. E., Arefyev A. V., Guliyev R. B.
Application of the microinterference method for reconstructing tomographic data on optical inhomogeneities of microoptic elements..... 79